CDx4ACT00 クワッド、2 入力、正論理 NAND ゲート

1 特長

- 入力は TTL 電圧互換
- バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減
- 伝搬遅延時間の平衡化
- ±24mA 出力駆動電流

  – 15 F デバイスへのファンアウト
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- MIL-STD-883、Method 3015 に準拠した 2kV を超える ESD 保護

2 概要

'ACT00 デバイスには、4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートは、ブール関数 $Y = \overline{A} \bullet \overline{B}$ を正論理で実行します。

製品情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ(2)	本体サイズ (3)
CDx4ACT00	D (SOIC、14)	8.65mm × 6mm	8.65mm × 3.9mm
	N (PDIP、14)	19.3mm × 9.4mm	19.3mm × 6.35mm
	J (CDIP、14)	19.55mm × 7.9mm	19.55mm × 6.7mm

(1) 詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
(3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



各ゲートの論理図 (正論理)

このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

Table of Contents

1 特長 ... 1
2 概要 ... 1
3 Pin Configuration and Functions ... 3
4 Specifications ... 4
4.1 Absolute Maximum Ratings ... 4
4.2 ESD Ratings ... 4
4.3 Recommended Operating Conditions ... 4
4.4 Thermal Information ... 4
4.5 Electrical Characteristics ... 5
4.6 Switching Characteristics ... 5
4.7 Operating Characteristics ... 5
5 Parameter Measurement Information ... 6
6 Detailed Description ... 7
6.1 Functional Block Diagram ... 7
6.2 Device Functional Modes ... 7
7 Application and Implementation ... 8
7.1 Power Supply Recommendations ... 8
7.2 Layout ... 8
8 Device and Documentation Support ... 9
8.1 Documentation Support (Analog) ... 9
8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法 ... 9
8.3 サポート・リソース ... 9
8.4 Trademarks ... 9
8.5 静電気放電に関する注意事項 ... 9
8.6 用語集 ... 9
9 Revision History ... 9
10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information ... 10

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

3 Pin Configuration and Functions

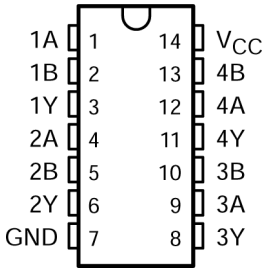


図 3-1. CD54ACT00 J Package, 14-Pin CDIP; CD74ACT00 N or D Package, 14-Pin PDIP or SOIC (Top View)

表 3-1. Pin Functions

PIN		I/O	DESCRIPTION
NAME	SOIC, PDIP, CDIP		
1A	1	I	1A Input
1B	2	I	1B Input
1Y	3	O	1Y Output
2A	4	I	2A Input
2B	5	I	2B Input
2Y	6	O	2Y Output
3Y	8	O	3Y Output
3A	9	I	3A Input
3B	10	I	3B Input
4Y	11	O	4Y Output
4A	12	I	4A Input
4B	13	I	4B Input
GND	7	—	Ground Pin
NC	—	—	No Connection
V_{CC}	14	—	Power Pin

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

4 Specifications

4.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)

			MIN	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage		–0.5	6	V
I_{IK} (2)	Input clamp current	(V_I < 0 or V_I > V_{CC})		±20	mA
I_{OK} (2)	Output clamp current	(V_O < 0 or V_O > V_{CC})		±50	mA
I_O	Continuous output current	(V_O = 0 to V_{CC})		±50	mA
	Continuous current through V_{CC} or GND			±100	mA
T_{stg}	Storage temperature range		–65	150	°C

(1) Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
(2) The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

4.2 ESD Ratings

			VALUE	UNIT
$V_{(ESD)}$	Electrostatic discharge	Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1)	±2000	V

(1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process. Manufacturing with less than 500-V HBM is possible with the necessary precautions.

4.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)

		TA = 25°C		-40°C TO 85°C		-55°C TO 125°C		UNIT
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V_{CC}	Supply voltage	4.5	5.5	4.5	5.5	4.5	5.5	V
V_{IH}	High-level input voltage	2		2		2		V
V_{IL}	Low-level input voltage		0.8		0.8		0.8	V
V_I	Input voltage	0	V_{CC}	0	V_{CC}	0	V_{CC}	V
V_O	Output voltage	0	V_{CC}	0	V_{CC}	0	V_{CC}	V
I_{OH}	High-level output current		-24		-24		-24	mA
I_{OL}	Low-level output current		24		24		24	mA
Δt/Δv	Input transition rise or fall rate		10		10		10	ns/V

(1) All unused inputs of the device must be held at V_{CC} or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report, *Implications of Slow or Floating CMOS Inputs*, literature number SCBA004.

4.4 Thermal Information

THERMAL METRIC(1)		CD74ACT00		UNIT
		D (SOIC)	N (PDIP)	
		14 PINS	14 PINS	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	119.9	80	°C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the *Semiconductor and IC Package Thermal Metrics* application report, SPRA953.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

4.5 Electrical Characteristics

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		V_{CC}	T_A = 25 °C		-40°C TO 85°C		-55°C TO 125°C		UNIT
				MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V_{OH}	V_I = V_{IH} or V_{IL}	I_{OH} = -50 µA	4.5 V	4.4		4.4		4.4		V
		I_{OH} = -24 mA	4.5 V	3.94		3.8		3.7		
		I_{OH} = -50 mA(1)	5.5 V					3.85		
		I_{OH} = -75 mA(1)	5.5 V			3.85				
V_{OL}	V_I = V_{IH} or V_{IL}	I_{OL} = 50 µA	4.5 V		0.1		0.1		0.1	V
		I_{OL} = 24 mA	4.5 V		0.36		0.44		0.5	
		I_{OL} = 50 mA(1)	5.5 V						1.65	
		I_{OL} = 75 mA(1)	5.5 V				1.65			
I_I	V_I = V_{CC} or GND		5.5 V		±0.1		±1		±1	µA
I_{CC}	V_I = V_{CC} or GND,	I_O = 0	5.5 V		4		40		80	µA
ΔI_{CC}	V_I = V_{CC} - 2.1 V		4.5 V to 5.5 V		2.4		2.8		3	mA
C_i					10		10		10	PF

(1) Test one output at a time, not exceeding 1-second duration. Measurement is made by forcing indicated current and measuring voltage to minimize power dissipation. Test verifies a minimum 50-Ω transmission-line drive capability at 85°C and 75-Ω transmission-line drive capability at 125°C.

表 4-1. Act Input Load Table

INPUT	UNIT LOAD
A or B	0.15

Unit load is ΔI_{CC} limit specified in electrical characteristics table (e.g., 2.4 mA at 25°C).

4.6 Switching Characteristics

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 5 V ± 0.5 V, C_L = 50 pF (unless otherwise noted) (see 図 5-1)

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	–40°C TO 85°C		–55°C TO 125°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	
t_{PLH}	A or B	Y	3.4	9.5	3.2	10.8	ns
t_{PHL}			2.8	8	2.7	13.2	

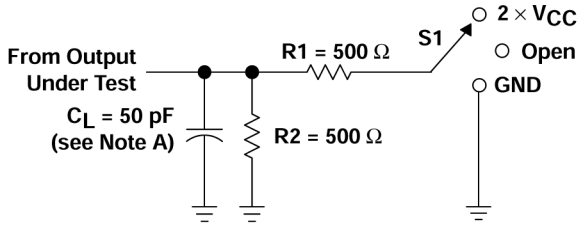
4.7 Operating Characteristics

V_{CC} = 5 V, T_A = 25°C

PARAMETER	TYP	UNIT
C_{pd} Power dissipation capacitance	45	pF

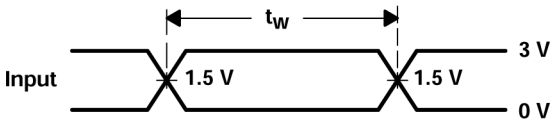
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5 Parameter Measurement Information

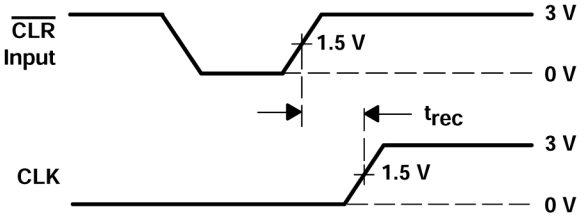


LOAD CIRCUIT

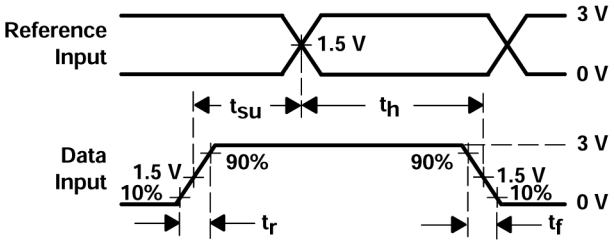
TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	2 × V_{CC}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND



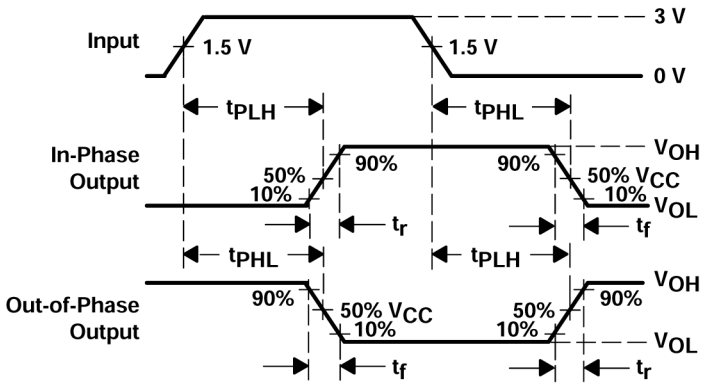
VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE DURATION



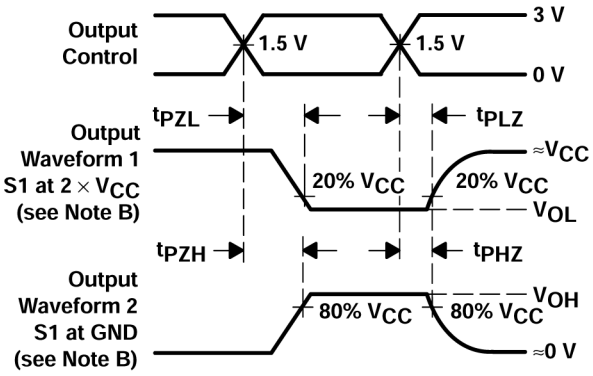
VOLTAGE WAVEFORMS
RECOVERY TIME



VOLTAGE WAVEFORMS
SETUP AND HOLD AND INPUT RISE AND FALL TIMES



VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIMES



VOLTAGE WAVEFORMS
OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES

A. C_L includes probe and test-fixture capacitance.
B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high except when disabled by the output control.
C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR ≤ 1 MHz, Z_O = 50 Ω, t_r = 3 ns, t_f = 3 ns. Phase relationships between waveforms are arbitrary.
D. For clock inputs, f_{max} is measured with the input duty cycle at 50%.
E. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
F. t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd}.
G. t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en}.
H. t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis}.

図 5-1. Load Circuit and Voltage Waveforms

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

6 Detailed Description

6.1 Functional Block Diagram



図 6-1. Logic Diagram, Each Gate (Positive Logic)

6.2 Device Functional Modes

Function Table (Each Gate) is the function table for the CDx4ACT00.

表 6-1. Function Table (Each Gate)

INPUTS		OUTPUT Y
A	B	
H	H	L
L	X	H
X	L	H

7 Application and Implementation

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

7.1 Power Supply Recommendations

The power supply can be any voltage between the minimum and maximum supply voltage rating located in the *セクション 4.1* table.

Each V_{CC} pin should have a good bypass capacitor to prevent power disturbance. For devices with a single supply, 0.1 µF is recommended. If there are multiple V_{CC} pins, 0.01 µF or 0.022 µF is recommended for each power pin. It is acceptable to parallel multiple bypass caps to reject different frequencies of noise. A 0.1 µF and 1 µF are commonly used in parallel. The bypass capacitor should be installed as close to the power pin as possible for best results.

7.2 Layout

7.2.1 Layout Guidelines

When using multiple bit logic devices inputs should not ever float.

In many cases, functions or parts of functions of digital logic devices are unused, for example, when only two inputs of a triple-input AND gate are used or only 3 of the 4 buffer gates are used. Such input pins should not be left unconnected because the undefined voltages at the outside connections result in undefined operational states. Specified in Layout Example for the CD74ACT00 are the rules that must be observed under all circumstances. All unused inputs of digital logic devices must be connected to a high or low bias to prevent them from floating. The logic level that must be applied to any particular unused input depends on the function of the device. Generally they will be tied to GND or V_{CC}; whichever makes more sense or is more convenient. It is generally acceptable to float outputs unless the part is a transceiver. If the transceiver has an output enable pin, it will disable the outputs section of the part when asserted. This will not disable the input section of the IOs, so they cannot float when disabled.

7.2.2 Layout Example

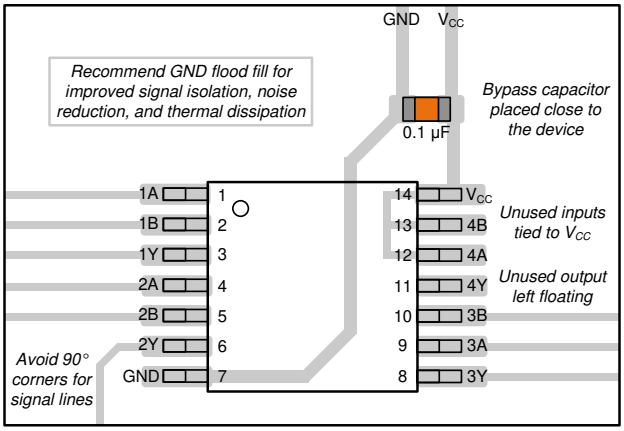


図 7-1. Layout Example for the CDx4ACT00

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

8 Device and Documentation Support

8.1 Documentation Support (Analog)

8.1.1 Related Documentation

The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.

表 8-1. Related Links

PARTS	PRODUCT FOLDER	SAMPLE & BUY	TECHNICAL DOCUMENTS	TOOLS & SOFTWARE	SUPPORT & COMMUNITY
CD54ACT00	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD74ACT00	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here

8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

8.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集　　この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision B (June 2002) to Revision C (August 2024)	Page
• 「製品情報」表、「ピンの機能」表、「ESD 定格」表、「熱に関する情報」表、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、および「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加	1
• Updated RθJA values: D = 86 to 119.9, all values in °C/W	4

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、テキサス・インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CD54ACT00F3A	Active	Production	CDIP (J) | 14	25 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54ACT00F3A
CD54ACT00F3A.A	Active	Production	CDIP (J) | 14	25 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54ACT00F3A
CD74ACT00E	NRND	Production	PDIP (N) | 14	25 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT00E
CD74ACT00E.A	NRND	Production	PDIP (N) | 14	25 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT00E
CD74ACT00M	Obsolete	Production	SOIC (D) | 14	-	-	Call TI	Call TI	-55 to 125	ACT00M
CD74ACT00M96	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT00M
CD74ACT00M96.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT00M
CD74ACT00M96G4	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT00M
CD74ACT00M96G4.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT00M

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

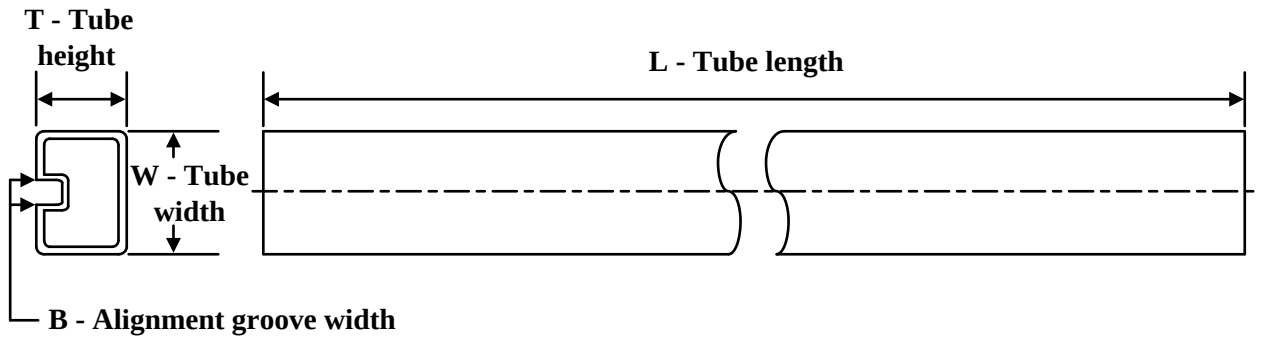
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF CD54ACT00, CD74ACT00 :

- Catalog : CD74ACT00
- Military : CD54ACT00

NOTE: Qualified Version Definitions:

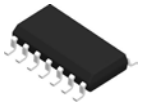
- Catalog - TI's standard catalog product
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (µm)	B (mm)
CD74ACT00E	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT00E	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT00E.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT00E.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32

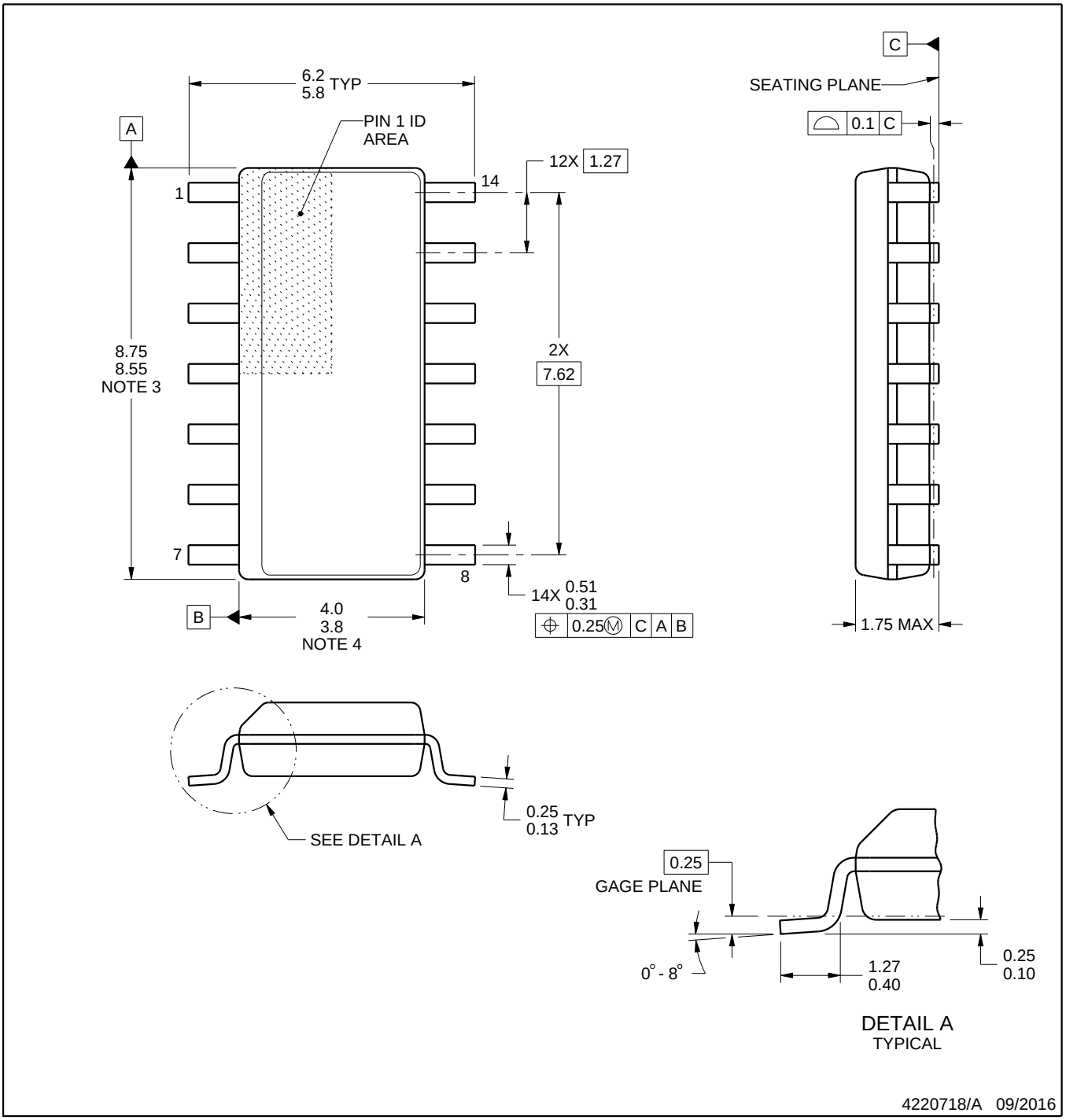


PACKAGE OUTLINE

D0014A

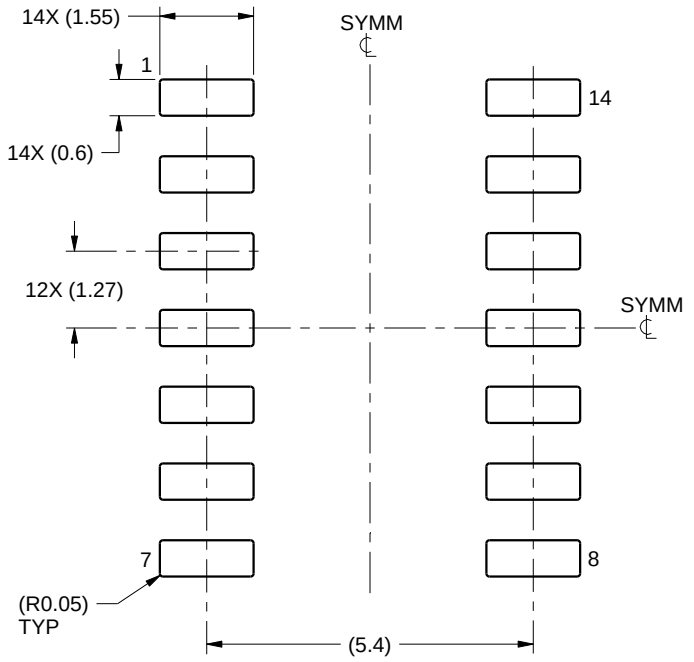
SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

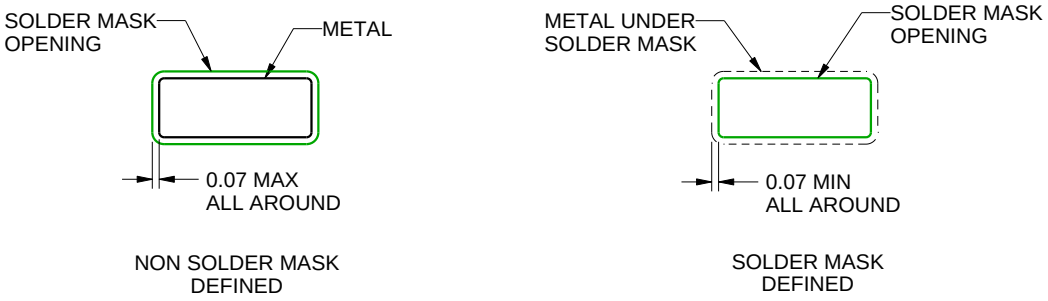


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

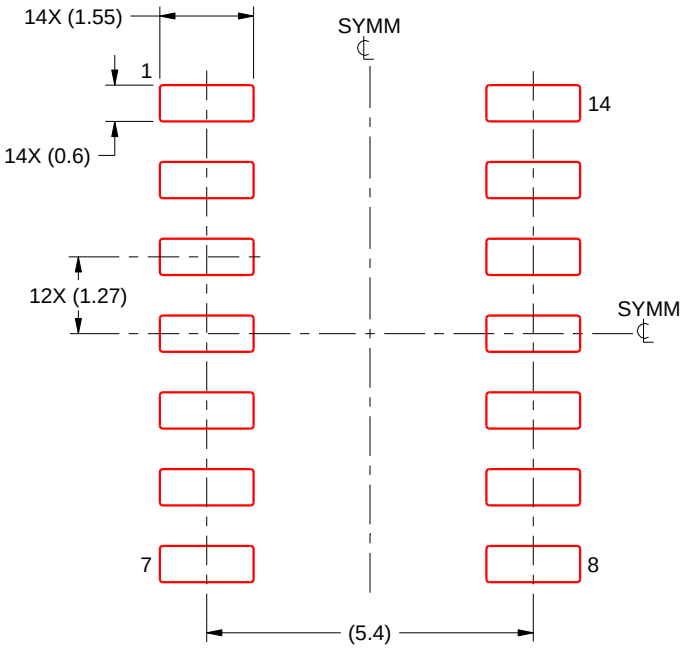
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

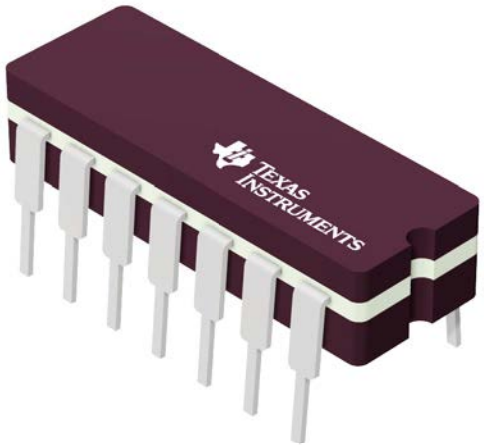
NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

J 14 CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

4040083-5/G

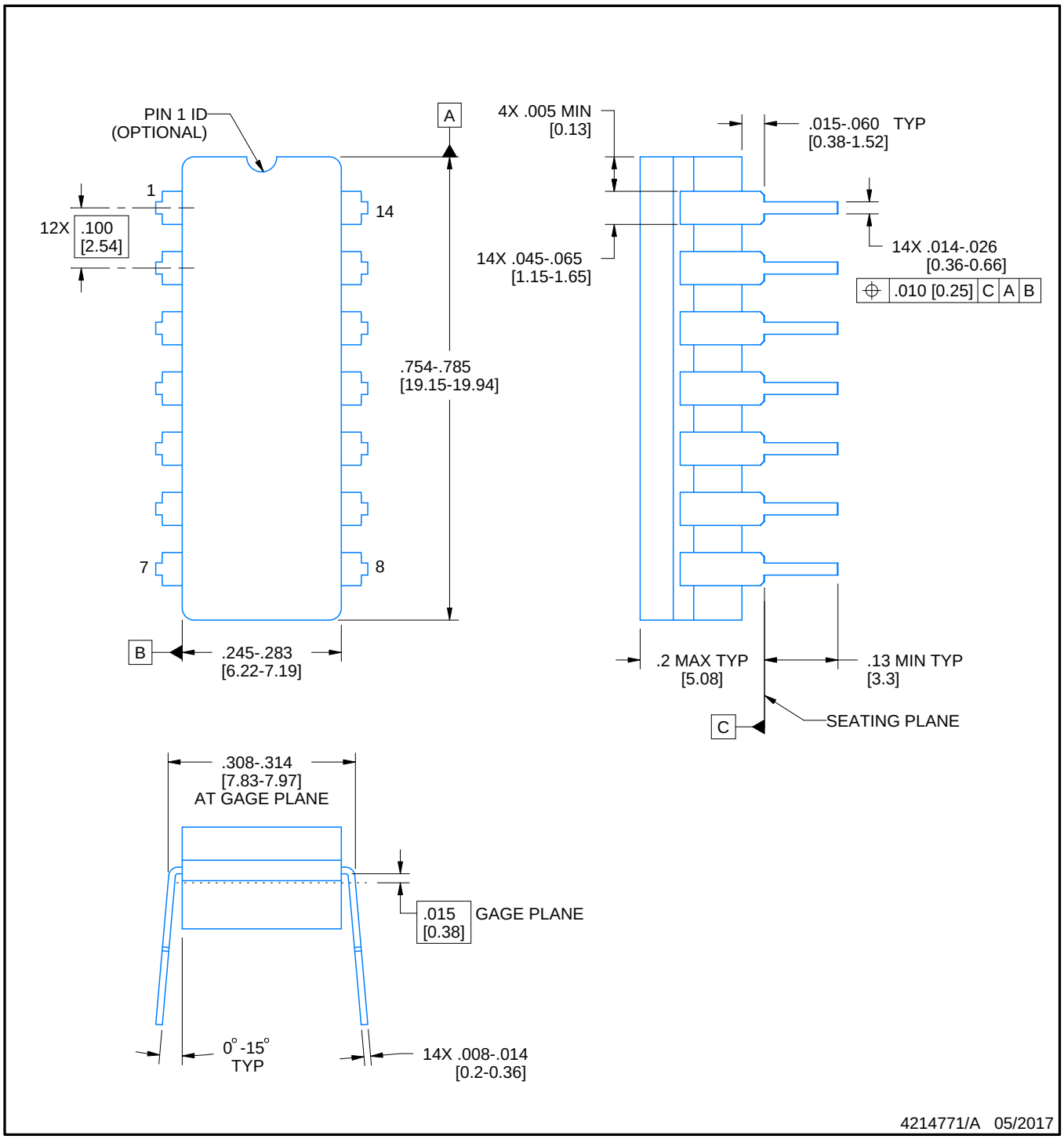


PACKAGE OUTLINE

J0014A

CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



NOTES:

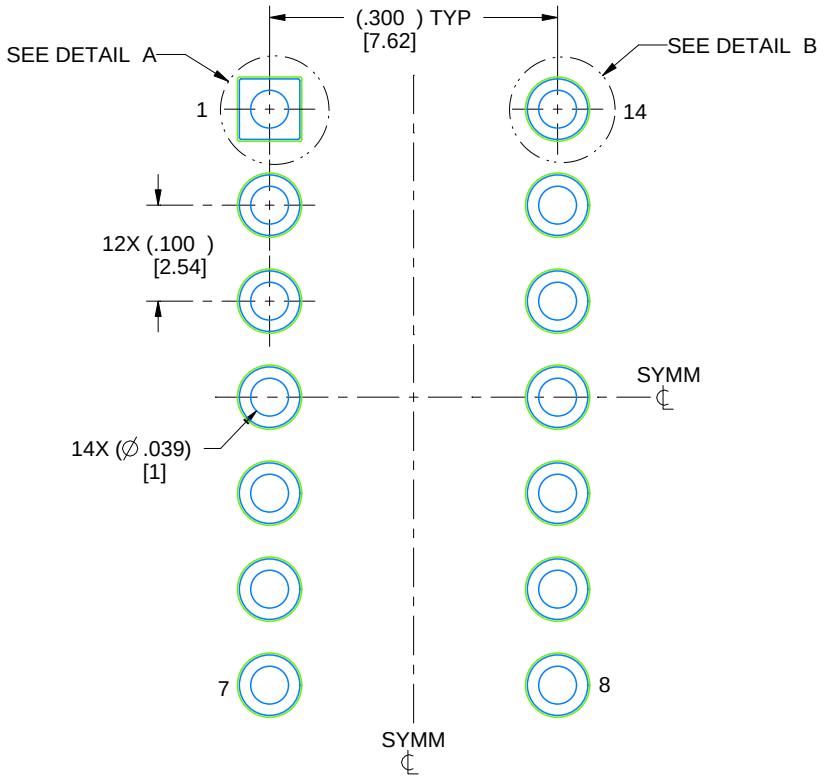
1. All controlling linear dimensions are in inches. Dimensions in brackets are in millimeters. Any dimension in brackets or parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package is hermitically sealed with a ceramic lid using glass frit.
4. Index point is provided on cap for terminal identification only and on press ceramic glass frit seal only.
5. Falls within MIL-STD-1835 and GDIP1-T14.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

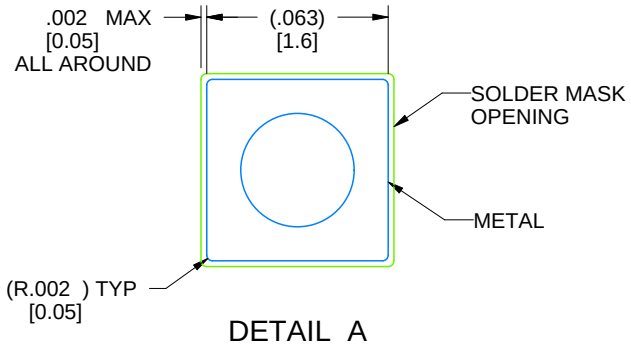
J0014A

CDIP - 5.08 mm max height

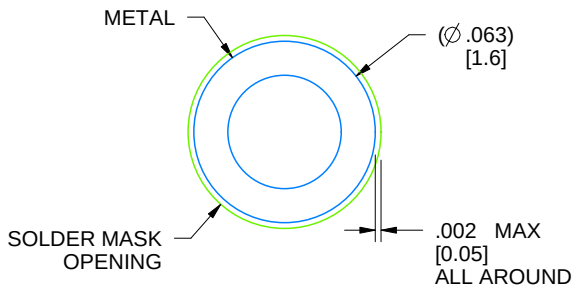
CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE: 5X



DETAIL A
SCALE: 15X



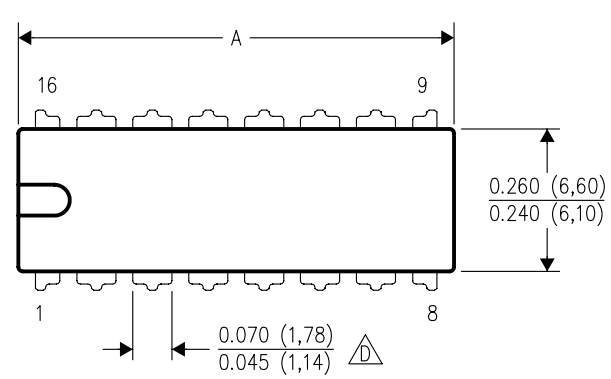
DETAIL B
13X, SCALE: 15X

4214771/A 05/2017

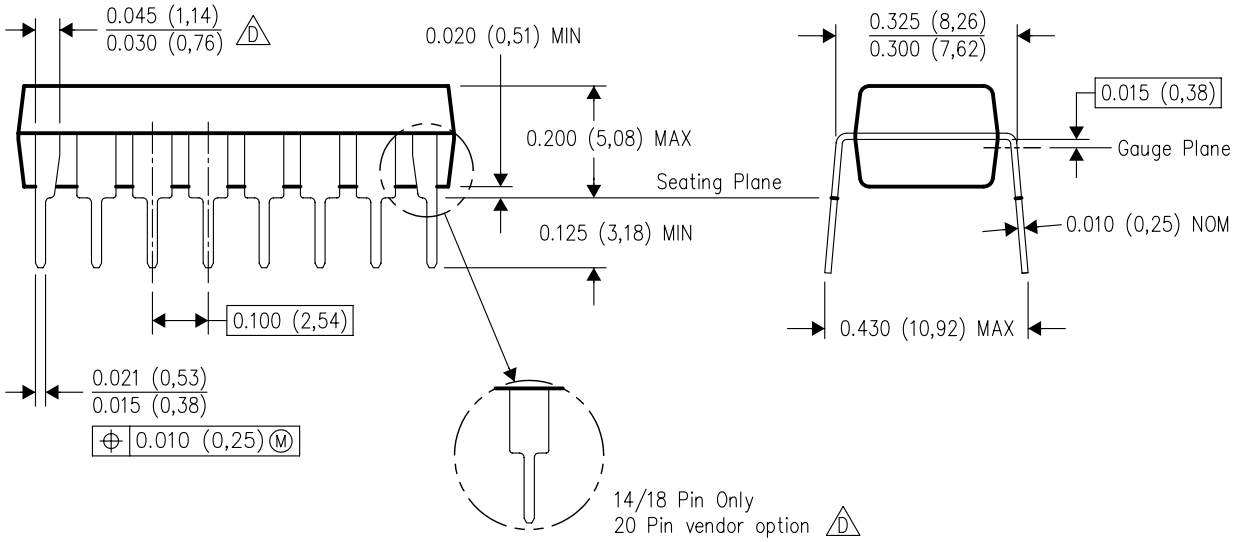
N (R–PDIP–T**)

PLASTIC DUAL–IN–LINE PACKAGE

16 PINS SHOWN



DIM \ PINS **	14	16	18	20
A MAX	0.775 (19,69)	0.775 (19,69)	0.920 (23,37)	1.060 (26,92)
A MIN	0.745 (18,92)	0.745 (18,92)	0.850 (21,59)	0.940 (23,88)
MS–001 VARIATION (C)	AA	BB	AC	AD



4040049/E 12/2002

NOTES:
A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MS–001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
D. The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月